Б1.Б.12.1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 1c6cfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820
Владелец: Троян Павел Ефимович
Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

«___» _____ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Уровень основной образовательной программы академический бакалавриат

Направления подготовки **11.03.04** «Электроника и наноэлектроника»

Профиль Промышленная электроника

Форма обучения очная

Факультет электронной техники (ФЭТ)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

Курс 2 **Семестр** 3

Учебный план набора 2013 года.

Распределение рабочего времени:

№	Виды учебной работы	Семестр 1	Семестр 2	Семестр 3	Семестр 4	Семестр 5	Семестр 6	Семестр 7	Семестр 8	Всего	Единицы
1.	Лекции			26						26	часов
2.	Лабораторные работы			16						16	часов
3.	Практические занятия			20						20	часов
4.	Курсовой проект/работа (КРС) (аудиторная)			-						-	часов
5.	Всего аудиторных занятий (Сумма 1-4)			62						62	часов
6.	Из них в интерактивной форме			14						14	часов
7.	Самостоятельная работа студентов (СРС)			82						82	часов
8.	Всего (без экзамена) (Сумма 5,7)			144						144	часов
9.	Самост. работа на подготовку, сдачу экзамена			-						-	часов
10.	Общая трудоемкость (Сумма 8,9)			144						144	часов
	(в зачетных единицах)			4						4	ЗЕТ

Диф. зачет 3 **семестр**

Томск 2017

Согласована на портале № 14487

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 77 от « 11 » 1 2017 г.

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 218, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической электроники от «_11_» ____01__ 2017 г., протокол № __77____.

Разработчики:
Профессор кафедры ФЭ _____ / ____П.Е. Троян___
Ассистент кафедры ФЭ _____ / ____В.В. Каранский

Заведующий кафедрой
Профессор кафедры ФЭ _____ / ____П.Е. Троян___

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами направления подготовки.

Декан_____ФЭТ_____ _____ / ____А.И. Воронин

Зав. профилирующей
кафедрой____ПрЭ_____ _____ / ____С.Г. Михальченко

Зав. выпускающей
кафедрой____ПрЭ_____ _____ / ____С.Г. Михальченко

Эксперты:
Председатель методической
комиссии факультета ФЭТ _____ / ____И.А. Чистоедова

Председатель методической
комиссии кафедры ПрЭ _____ / ____Н.С. Легостаев

Согласована на портале № 14487

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Твердотельная электроника» является приобретение знаний по физическим основам действия полупроводниковых приборов, их электрическим характеристикам для статического и динамического режимов работы, реакции приборов на внешние воздействия, представлению приборов в виде электрических моделей, методам экспериментального определения параметров моделей.

Задачей изучения дисциплины «Твердотельная электроника» является приобретение навыков и умений в вопросах правильного выбора вида полупроводниковых приборов для построения электронных схем, исходя из функциональных задач, решаемых этими схемами, и обеспечение грамотной эксплуатации приборов, позволяющих максимально использовать заложенные в них возможности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

В соответствии с основной образовательной программой дисциплина «Твердотельная электроника» относится к обязательным дисциплинам базовой части (Б1.Б.12.1).

Основой для изучения дисциплины «Твердотельная электроника» являются курсы: физика, материалы электронной техники.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: физика конденсированного состояния, схемотехника, наноэлектроника.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у бакалавров следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

– способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (**ОПК-1**);

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (**ОПК-2**);

– способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных (**ОПК-5**);

– способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (**ОПК-7**);

– способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования (**ПК-1**);

– способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения (**ПК-2**).

3.2. В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

знать:

– устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов;

– эквивалентные схемы приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем;

– функциональные электрические модели приборов и методы определения параметров моделей;

– методы анализа переходных процессов;

уметь:

– производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов;

– правильно выбирать элементы электронной схемы для решения поставленной задачи с максимальным использованием возможностей приборов, обеспечив при этом высокую надежность схем;

– анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда;

– экспериментально определять параметры твердотельных приборов;

владеть:

– навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем;

– методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов.

Согласована на портале № 14487

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	**62**	**62**
В том числе:		
Лекции	26	26
Лабораторные работы	16	16
Практические занятия	20	20
Самостоятельная работа (всего)	**82**	**82**
В том числе:		
Проработка лекционного материала	20	20
Подготовка к лабораторным работам	24	24
Выполнение и защита индивидуальных заданий ИЗ-1, ИЗ-2	24	24
Подготовка к контрольным работам КР-1, КР-2	14	14
Общая трудоемкость, час	**144**	**144**
Зачетные Единицы Трудоемкости	**4**	**4**

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа студента	Всего час	Формируемые компетенции (ОК, ПК, ПСК)
1.	Введение, цели и задачи дисциплины	1	-	-	-	1	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
2.	Физические основы твердотельной электроники	6	4	-	10	20	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
3.	Полупроводниковые диоды	4	4	8	17	33	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
4.	Биполярные транзисторы (БТ)	8	8	4	30	50	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
5.	Полевые транзисторы (ПТ)	4	4	4	15	27	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
6.	Тиристоры	3	-	-	10	13	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
	ИТОГО	**26**	**20**	**16**	**82**	**144**	

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

№ п/п	Наименование разделов	Содержание разделов	Трудоемкость (час.)	Формируемые компетенции (ОК, ПК, ПСК)
1.	Введение, цели и задачи дисциплины	Цели и задачи курса. Требования к объему знаний по дисциплине. Полупроводниковые приборы, как элементы электронных цепей (схем). Понятия, определения: электронные устройства, компоненты (пассивные и активные), полупроводниковые приборы. Основные разновидности полупроводниковых приборов по выполняемым функциям и технологии. Основные разделы курса лекций. Вклад отечественных ученых в развитие полупроводниковой техники. Список рекомендуемой литературы.	1	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
2.	Физические основы твердотельной электроники	Фундаментальная система уравнений – основа аналитического описания свойств полупроводниковых приборов. Аналитические выражения и физический смысл уравнений Пуассона, полного тока и непрерывности. Собственные и примесные полупроводники и их электропроводность. Компенсированные полупроводники. Зонная диаграмма этих материалов. Концентрация свободных носителей в собственном и примесном полупроводниках. Положение уровня Ферми в них. Зависимость концентрации свободных носителей от температуры. Физическое обоснование диапазона рабочих температур полупроводниковых приборов. По-	6	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2

Согласована на портале № 14487

		лупроводники в электрическом поле. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Виды генерации и рекомбинации: термогенерация, фотогенерация, полевая ионизация; рекомбинация зона-зона, рекомбинация через рекомбинационные уровни, излучательная и безизлучательная рекомбинация. Контакты металл-полупроводник и полупроводник-полупроводник с различным типом проводимости (p-n переход). Контакт металла с полупроводником (М-п/п) – зонная диаграмма. Выпрямляющий и омический контакт. Принцип выпрямления тока на контакте М-п/п по энергетическим диаграммам. ВАХ идеального контакта. Эффект Шоттки. Диод Шоттки. ВАХ реального контакта Шоттки. Распределение электрического поля в области пространственного заряда (ОПЗ) на контакте М-п/п и ширина ОПЗ. Емкость диода Шоттки. Эквивалентная схема и модель диода Шоттки. Особенности диода Шоттки. Омические контакты и их свойства. Механизм образования электронно-дырочного перехода (ЭДП). Определение ЭДП. Контактная разность потенциалов, ее зависимость от концентрации легирующей примеси, температуры и ширины запрещенной зоны. Энергетические диаграммы ЭДП при прямом и обратном смещениях. Потоки носителей зарядов и принцип выпрямления тока ЭДП. Инжекция и экстракция носителей. Концентрация неосновных носителей заряда у границ ЭДП. Методы получения ЭДП: сплавление, диффузия, ионное легирование, эпитаксия. Понятие плавного и резкого, симметричного и несимметричного ЭДП, точечные и плоскостные ЭДП.		
3.	Полупроводниковые диоды	Эквивалентная схема диода. Параметры эквивалентной схемы: дифференциальное сопротивление, сопротивление постоянному току, сопротивление базы, диффузионная и барьерная емкости. Зависимость параметров эквивалентной схемы от частоты ($F_{пред}$) для диодов с толстой и тонкой базами. Эквивалентная схема диода для высоких частот. Переходные процессы в диодах: включение и переключение для низкого уровня инжекции; включение и отключение для высокого уровня инжекции; эффекты накопления и рассасывания неосновных носителей в базе диода. Понятие низких, средних и высоких частот. Зависимость выпрямляющих свойств диода от частоты (f_{max}). Анализ переходных процессов методом заряда. Классификация диодов. Маркировка диодов. Выпрямительные диоды: определение, основные параметры. Импульсные диоды: определение, специфические характеристики, применение. Диоды с накоплением заряда. Универсальные диоды, СВЧ-диоды. Стабилитроны: принцип действия, схема включения, основные параметры, последовательно-параллельное включение. Туннельные диоды: принцип действия по энергетическим диаграммам, параметры, эквивалентная схема, применение. Обращенные диоды: принцип действия, применение. Варикапы: принцип действия, основные параметры. Приборы оптоэлектроники - фоторезистор, светоизлучающий диод, фотодиод, оптопары, лазеры: устройство, принцип действия, основные параметры, режимы работы, применение. Лавинопролетные диоды, диоды Ганна. Модели полупроводниковых диодов: статическая, зарядоуправляемая.	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
4.	Биполярные транзисторы (БТ)	Схема потоков носителей зарядов в БТ. Внутренние физические параметры БТ: эффективность эмиттера, коэффициент переноса, эффективность коллектора. Внешние параметры	8	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2

Согласована на портале № 14487

		БТ: коэффициент передачи тока эмиттера, коэффициент передачи тока базы. Связь между внутренними и внешними параметрами в БТ. Статические параметры трех режимов работы БТ. Явление в БТ при больших токах. Эффект модуляции базы (эффект Эрли) и его следствия. Пробой БТ. Особенности пробоя БТ в схеме с ОЭ. Статические характеристики БТ в схеме с ОБ и ОЭ. Динамические характеристики БТ. Области активной работы, режима отсечки и насыщения. Предельные режимы по току и напряжению. Усилительные свойства БТ в схемах с ОБ, ОЭ и ОК. Частотные параметры БТ: предельная частота коэффициента передачи тока эмиттера, предельная частота коэффициента передачи тока базы, граничная частота, максимальная частота генерации. Зависимость эффективности эмиттера, коэффициента переноса, коэффициентов передачи тока эмиттера и тока базы от частоты. Переходные процессы в БТ для включения с ОБ и ОЭ. Характеристики переходных процессов: $t_з$, $t_н$, $t_{расс}$, $t_{сп}$, $t_{вкл}$, $t_{выкл}$. Описание переходных процессов методом заряда. Температурные зависимости динамических характеристик. Зависимость коэффициентов передачи токов эмиттера и базы от температуры. Термостабильность схем с ОБ и ОЭ. Описание БТ как линейного четырехполюсника. Система y-, z- и h- параметров. Схемы замещения БТ в y-, z- и h-параметрах. Переход от одной системы параметров к другой. Смысл h-параметров. Взаимосвязь h-параметров с физическими параметрами БТ. Расчет h-параметров по физическим параметрам БТ и наоборот. Методы определения h-параметров. Физическая эквивалентная схема БТ. Эквивалентная схема БТ с ОБ и ОЭ для низких частот. Эквивалентная схема БТ для высоких частот. Параметры эквивалентной схемы БТ. Зависимость параметров БТ от $I_э$, T и $U_к$. П-образная и гибридная эквивалентные схемы. Мощные БТ. Составной транзистор (транзистор Дарлингтона). Лавинный транзистор. Однопереходный транзистор. Инжекционный транзистор. IGBT-транзистор. Модели БТ: Эберса-Молла, зарядоуправляемая. Шумы в БТ: определение шума, виды шумов, их зависимость от частоты, $I_Э$, $U_к$.		
5.	Полевые транзисторы (ПТ)	ПТ с управляющим p-n переходом. Устройство ПТ. Принцип действия. Явление отсечки канала, $U_{ОТС}$. Причины, приводящие к отсечке тока и приращения тока. Процессы в ПТ после отсечки приращения тока. Качественный вид выходных ВАХ. Расчет выходных ВАХ ПТ с управляющим переходом. Передаточная характеристика. Основные характеристики усилительного режима: крутизна, внутреннее сопротивление, коэффициент усиления по напряжению. Эквивалентная схема ПТ с управляющим переходом. Граничная частота, критерий граничной частоты. Схемы замещения для НЧ и ВЧ для трех схем включения ПТ. Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом (МДП-транзистор). Устройство. Принцип действия. Напряжение $U_{пор}$. Качественный вид входных и выходных ВАХ МДП-транзистора. Передаточная характеристика. Расчет выходных статических характеристик. Основные параметры усилительного и ключевого режимов работы. Переходные процессы. Комплементарная пара. Эквивалентная схема. Модели МДП-транзистора: динамическая модель малого и большого сигналов. Статическая и динамическая модель мощных ПТ. Полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенным каналом. Устройство, принцип действия, эквивалентная	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2

Согласована на портале № 14487

		схема. Семейство выходных статических характеристик. Передаточные характеристики. Отличие транзистора со встроенным каналом от прибора с индуцированным каналом. Транзисторы с n-каналами и самосовмещенными затворами. Параметры и характеристики транзисторов с короткими каналами. Разновидности полевых транзисторных структур СБИС. Особенности полевых транзисторов с управляющими переходами в интегральном исполнении. Паразитная связь между элементами через полуизолирующую подложку. Интегральные схемы на ПТШ на основе арсенида галлия. HEMT-транзисторы.		
6.	Тиристоры	Общие сведения о тиристорах. Классификация и условно-графические обозначения тиристоров. Устройство и принцип действия диодного тиристора. Триодный незапираемый тиристор. Триодный запираемый тиристор. Симметричные тиристоры. Эффекты dU/dt и dI/dt. Основные параметры тиристоров. Маркировка тиристоров.	3	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
Предшествующие дисциплины							
1.	физика	+	+	+	+	+	+
2.	материалы электронной техники	+	+	+	+	+	+
Последующие дисциплины							
1.	физика конденсированного состояния	+	-	+	+	+	+
2.	схемотехника	-	-	+	+	+	+
3.	наноэлектроника	+	+	+	+	+	+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень компетенций	Виды занятий				Формы контроля
	Л	ПЗ	ЛР	СРС	
ОПК-1	+	+	+	+	Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Защита отчетов по практическим занятиям. Защита отчетов по лабораторным работам. Оценка за контрольную работу.
ОПК-2	+	+	+	+	Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Защита отчетов по практическим занятиям. Защита отчетов по лабораторным работам. Оценка за контрольную работу.
ОПК-5	+	+	+	+	Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Защита отчетов по практическим занятиям. Защита отчетов по лабораторным работам. Оценка за контрольную работу.
ОПК-7	+	+	+	+	Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Защита отчетов по практическим занятиям. Защита отчетов по лабораторным работам. Оценка за контрольную работу.
ПК-1	+	+	+	+	Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Защита отчетов по практическим занятиям. Защита отчетов по лабораторным работам. Оценка за контрольную работу.
ПК-2	+	+	+	+	Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Защита отчетов по практическим занятиям. Защита отчетов по лабораторным работам. Оценка за контрольную работу.

Согласована на портале № 14487

6. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы \ Формы	Лекции (час)	Практические занятия (час)	Лабораторные работы (час)	Всего
Работа в команде		4	4	8
Опрос на лекциях	6			6
Итого интерактивных занятий	6	4	4	14

7. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика лабораторных работ	Трудоемкость (час.)	Компетенции ОК, ПК, ПСК
1.	**3**	Определение времени восстановления обратного сопротивления диода	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
2.	**3**	Исследование вольт-емкостных характеристик полупроводникового диода	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
3.	**3**	Исследование вольт-амперной характеристики полупроводникового диода	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
4.	**4**	Биполярные транзисторы: статические характеристики БТ	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
5.	**4**	Биполярные транзисторы: исследование мощного БТ	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
6.	**5**	Полевые транзисторы	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2

Из предлагаемого перечня лабораторных работ студенты выполняют 4 работы.

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость (час.)	Компетенции ОК, ПК, ПСК
1.	**2**	Физические основы твердотельной электроники	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
2.	**3**	Расчет параметров полупроводниковых диодов	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
3.	**4**	Схемы включения и режимы работы биполярного транзистора	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
4.	**4**	Расчет внутренних параметров биполярного транзистора	1	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
5.	**4**	Расчет внешних параметров биполярного транзистора	1	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
6.	**4**	Эффект Эрли в биполярных транзисторах	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
7.	**4**	Определение малосигнальных параметров биполярного транзистора	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
8.	**5**	Расчет параметров полевых транзисторов	4	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
9.	**3**	КР-1. Расчет параметров полупроводниковых диодов	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2
10.	**4**	КР-2. Расчет параметров биполярных транзисторов	2	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика самостоятельной работы *(детализация)*	Трудоемкость (час.)	Компетенции ОК, ПК, ПСК	Контроль выполнения работы
1.	**2-6**	Проработка лекционного материала	10	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2	Опрос на лекциях
2.	**3-5**	Проработка лекционного материала при подготовке к практическим занятиям	10	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2	Отчеты по практическим работам
3.	**3, 4**	Проработка лекционного материала при подготовке к контрольным работам	14	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2	Результаты контрольных работ
4.	**3-5**	Подготовка к лабораторным работам	24	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2	Отчеты по лабораторным работам
4.	**3, 4**	Выполнение и защита индивидуальных заданий ИЗ-1, ИЗ-2	24	ОПК-1,2,5,7; ПК-1,2	Защита индивидуальных заданий

Тематика индивидуальных заданий:

1. Расчет полупроводниковых диодов.
2. Расчет параметров биполярных транзисторов.

Согласована на портале № 14487

10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

не предусмотрено

11. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Таблица 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
Выполнение и защита индивидуальных заданий		15	15	**30**
Контрольные работы	10	10		**20**
Защита лабораторных работ		10	10	**20**
Итого максимум за период:	**10**	**35**	**25**	**70**
Сдача дифференциального зачета (максимум)				**30**
Нарастающим итогом	**10**	**45**	**70**	**100**

Таблица 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

Таблица 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	**90 – 100**	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	**85 – 89**	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	**65 – 69**	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно), (не зачтено)	**Ниже 60 баллов**	F (неудовлетворительно)

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Фундаментальная система уравнений твердотельной электроники.
2. Собственные, примесные и компенсированные полупроводники.
3. Генерация и рекомбинация носителей в полупроводниках.
4. Контакт металл-полупроводник.
5. Диод Шоттки.
6. Омические контакты.
7. Механизм образования электронно-дырочного перехода (ЭДП).
8. Контактная разность потенциалов, ее зависимость от концентрации легирующей примеси, температуры и ширины запрещенной зоны.
9. Энергетические диаграммы ЭДП при прямом и обратном смещениях.
10. Потоки носителей зарядов и принцип выпрямления тока ЭДП.
11. Методы получения ЭДП: сплавление, диффузия, ионное легирование, эпитаксия.
12. Понятие плавного и резкого, симметричного и несимметричного ЭДП, точечные и плоскостные ЭДП.
13. Классификация диодов.
14. Выпрямительные диоды.
15. Варикапы.
16. Стабилитрон.
17. Туннельный диод.

Согласована на портале № 14487

18. Фотодиод.
19. Светодиод.
20. Биполярный транзистор (БТ): определение, схемы включения, режимы работы.
21. Дрейфовый и бездрейфовый БТ.
22. Схема потоков носителей в БТ.
23. Внутренние параметры БТ: γ, $\alpha_П$, α^*.
24. Внешние параметры БТ: α, β.
25. Статические характеристики БТ.
26. Усилительные свойства БТ.
27. Частотные параметры БТ.
28. Эквивалентная схема БТ.
29. БТ как четырехполюсник. Система y, z, h – параметров.
30. Мощные БТ.
31. Лавинный БТ.
32. Однопереходный транзистор.
33. Инжекционный транзистор.
34. Шумы в БТ.
35. Модель Эберса–Молла.
36. Классификация и маркировка БТ.
37. Полевые транзисторы (ПТ): определение, виды.
38. ПТ с управляющим переходом и барьером Шоттки.
39. ПТ с индуцированным и встроенным каналом.
40. Комплементарная пара. Параметры ПТ. Достоинства и недостатки.
41. Вертикальный МДП-транзистор.
42. ПТШ.
43. HEMT.
44. Тиристоры: определение, виды.
45. Принцип действия диодного тиристора.
46. Триодный тиристор.
47. Симметричный тиристор.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1 Основная литература

1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физические основы электроники. – Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2013. – 560 с. – [электронный ресурс]. – https://e.lanbook.com/book/5856

2. Шангин, А. С. Твердотельные приборы и устройства: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Шангин А. С. — Томск: ТУСУР, 2012. — 156 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2438

12.2 Дополнительная литература

1. Троян П.Е. Твердотельная электроника. – Учебное пособие. – Томск: ТУСУР, 2006. – 321 с. **(48)**

2. Гаман З.И. Физика полупроводниковых приборов: Учебное пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2000. – 426 с. **(45)**

3. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. – М.: Сов. радио, 1990. – 264 с. **(21)**

4. Крутякова М.Г., Чарыков Н.А., Юдин В.В. Полупроводниковые приборы и основы их проектирования. – М.: Радио и связь, 1983. – 352 с. **(6)**

5. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2006. – 480 с. **(98)**

6. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учебное пособие. – М.: Техносфера, 2005. – 408 с. (**88)**

7. Твердотельная электроника: учебное пособие для вузов / Э. Н. Воронков [и др.]. – М.: Академия, 2009. – 317 с. **(4)**

12.3 Учебно-методические пособия и программное обеспечение

1. Троян П.Е. Твердотельная электроника. Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе. – Томск: ТУСУР, 2007. – 76 с. **(47)**

2. Жигальский А.А. Твердотельная электроника: Методические указания по выполнению лабора-

Согласована на портале № 14487

торных работ. – Томск: ТУСУР, 2007. – 59 с. (**29**)

12.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Образовательный портал в свободном доступе: «Физика, химия, математика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. Варгина» – Режим доступа: http://www.ph4s.ru/

2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа: http://window.edu.ru/

3. «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru

4. «Научно-образовательный портал ТУСУР» [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал университета. – Режим доступа: http://edu.tusur.ru/

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

13.1 Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

13.1.2 Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством посадочных мест не менее 60, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2 Материально-техническое обеспечение для практических занятий

Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, с количеством посадочных мест не менее 30, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью.

13.1.3 Материально-техническое обеспечение для лабораторных работ

Для проведения лабораторных занятий используется «Лаборатория твердотельной электроники и микроэлектроники», расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74, 1 этаж, ауд. 115б. Лаборатория оснащена следующим оборудованием: меловая доска, лабораторный стенд «Физические основы электроники», лабораторный макет «Исследование вольт-амперной характеристики p-n перехода», лабораторный макет «Исследование вольт-емкостных характеристик полупроводникового диода», лабораторный макет «Изучение переходных процессов в полупроводниковом диоде», лабораторный макет «Исследование статических характеристик биполярного транзистора», лабораторный макет «Исследование характеристик полевого транзистора с управляющим p-n переходом».

13.1.4 Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74, 2 этаж, ауд. 217. Состав оборудования: учебная мебель; доска магнитомаркерная.

13.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мо-

Согласована на портале № 14487

бильной системы обучения для людей с инвалидностью.

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

1. в печатной форме;
2. в печатной форме с увеличенным шрифтом;
3. в форме электронного документа;
4. методом чтения ассистентом задания вслух;
5. предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

1. письменно на бумаге;
2. набор ответов на компьютере;
3. набор ответов с использованием услуг ассистента;
4. представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в форме электронного документа;

в печатной форме увеличенным шрифтом.

Согласована на портале № 14487

Для лиц с нарушениями слуха:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в форме электронного документа;
в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Без рекомендаций.

Согласована на портале № 14487

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
(Проректор по учебной работе)
_____ П.Е. Троян
«___» _____ 2017 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Уровень основной образовательной программы академический бакалавриат

Направления подготовки **11.03.04** «Электроника и наноэлектроника»

Профиль Промышленная электроника

Форма обучения очная

Факультет электронной техники (ФЭТ)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

Курс 2 **Семестр** 3

Учебный план набора 2013 года.

Диф. зачет 3 **семестр**

Разработчики:
Профессор кафедры ФЭ _____ / П.Е. Троян
Ассистент кафедры ФЭ _____ / В.В. Каранский

Томск 2017

Согласована на портале № 14487

1. ВВЕДЕНИЕ

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе учебной дисциплины «Твердотельная электроника» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по учебной дисциплине «Твердотельная электроника» используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной «Твердотельная электроника» компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции
ОПК-1	способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики	*знать* методы анализа переходных процессов; *уметь* анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда; *владеть* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
ОПК-2	способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат	*знать* методы анализа переходных процессов; *уметь* анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда; *владеть* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
ОПК-5	способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных	*знает* основные приемы обработки экспериментальных данных; *умеет* применять методы анализа и обработки экспериментальных данных; *владеет* системным подходом к анализу результатов экспериментальных данных; *владеет* методами обработки результатов измерения параметров твердотельных приборов
ОПК-7	способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности	*знает* современные тенденции развития электроники; *знает* современные тенденции развития измерительной и вычислительной техники; *умеет* использовать современное оборудование в своей профессиональной деятельности; *умеет* учитывать современные тенденции развития электроники; *иметь опыт* работы с современным оборудованием, используемым в своей профессиональной деятельности.
ПК-1	способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования	*знать* эквивалентные схемы приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; *знать* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов; *уметь* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; *уметь* экспериментально определять параметры твердотельных приборов; *владеть* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
ПК-2	способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения	*знает* эквивалентные схемы приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; *знает* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов; *умеет* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; *умеет* экспериментально определять параметры твердотельных приборов; *владеть* методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов.

Согласована на портале № 14487

2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1 Компетенция ОПК-1

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Содержание этапов формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	*знает* методы анализа переходных процессов	*умеет* анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда	*владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
Виды занятий	Лекции; Практические занятия; Групповые консультации	Практические занятия; Лабораторные работы; Индивидуальное задание; Самостоятельная работа	Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	Опрос на лекции; Контрольная работа; Индивидуальное задание (защита); Лабораторная работа (защита); Зачет	Индивидуальное задание (выполнение, оформление); Лабораторная работа (выполнение, оформление)	Лабораторная работа (защита); Зачет

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех этапах приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	обладает базовыми общими знаниями	обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	работает при прямом наблюдении

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	*понимает* связь между переходными процессами и	*умеет* физически анализировать переходные процес-	*свободно владеет* разными способами представления

Согласована на портале № 14487

	полупроводниковыми приборами; *аргументирует* выбор метода анализа переходных процессов;	сы в полупроводниковых приборах с использованием метода заряда; *умеет* математически описывать переходные процессы в полупроводниковых приборах с использованием метода заряда	физической информации в графической и математической форме; *владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
Хорошо (базовый уровень)	*знает* переходные процессы в полупроводниковых приборах; *имеет* представление о методах анализа переходных процессов;	*самостоятельно подбирает* и готовит для эксперимента необходимое оборудование; *умеет* анализировать переходные процессы в полупроводниковых приборах	*способен классифицировать* полупроводниковые приборы и элементы интегральных схем *владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	*дает* определения основных понятий; *распознает* переходные процессы в полупроводниковых приборах; *знает* основные методы анализа переходных процессов;	*умеет* работать со справочной литературой; *использует* приборы, указанные в описании лабораторной работы;	*владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем

2.2 Компетенция ОПК-2

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Содержание этапов формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	*знать* методы анализа переходных процессов;	*уметь* анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда;	*владеть* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
Виды занятий	Лекции; Практические занятия; Групповые консультации	Практические занятия; Лабораторные работы; Индивидуальное задание; Самостоятельная работа	Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	Опрос на лекции; Контрольная работа; Индивидуальное задание (защита); Лабораторная работа (защита); Зачет	Индивидуальное задание (выполнение, оформление); Лабораторная работа (выполнение, оформление)	Лабораторная работа (защита); Зачет

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех этапах приведены в таблице 2.2 в п. 2.1.

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.5.

Согласована на портале № 14487

Таблица 2.5 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	*знает* методы анализа переходных процессов для описания твердотельных приборов; *знает* основные проблемы, которые могут возникнуть при исследовании переходных процессов в твердотельных приборов; *знает* основные проблемы, которые могут возникнуть при анализе переходных процессов в твердотельных приборов.	*умеет* анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда; *умеет* применять физико-математический аппарат при описании переходных процессов в твердотельных приборов.	*владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем; *использует* физико-математический аппарат в своей профессиональной деятельности при описании переходных процессов.
Хорошо (базовый уровень)	*знает* методы анализа переходных процессов для описания твердотельных приборов; *знает* основные проблемы, которые могут возникнуть при исследовании переходных процессов в твердотельных приборов.	*умеет* применять физико-математический аппарат при описании переходных процессов в твердотельных приборов.	*использует* физико-математический аппарат в своей профессиональной деятельности при описании переходных процессов.
Удовлетворительно (пороговый уровень)	*знает* основные проблемы, которые могут возникнуть при исследовании переходных процессов в твердотельных приборов.	*применяет* физико-математический аппарат при описании переходных процессов в твердотельных приборов, под руководством преподавателя.	*использует* физико-математический аппарат в своей профессиональной деятельности при описании переходных процессов, под руководством преподавателя.

2.3 Компетенция ОПК-5

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Содержание этапов формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	*знает* основные приемы обработки экспериментальных данных;	*умеет* применять методы анализа и обработки экспериментальных данных;	*владеет* системным подходом к анализу результатов научных исследований; *владеет* методами обработки результатов измерения параметров твердотельных приборов
Виды занятий	Лекции; Практические занятия; Групповые консультации	Практические занятия; Лабораторные работы; Индивидуальное задание; Самостоятельная работа	Лабораторные работы;
Используемые	Опрос на лекции;	Индивидуальное задание	Лабораторная работа (защи-

Согласована на портале № 14487

средства оценивания	Контрольная работа; Индивидуальное задание (защита); Лабораторная работа (защита); Зачет	(выполнение, оформление); Лабораторная работа (выполнение, оформление)	та); Зачет

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех этапах приведены в таблице 2.2 в п. 2.1.

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Показатели и критерии	**Знать**	**Уметь**	**Владеть**
Отлично (высокий уровень)	*знает* основные приемы обработки экспериментальных данных при исследование параметров твердотельных приборов; *знает* методы обработки экспериментальных данных при исследование параметров твердотельных приборов; *знает* основные подходы к планированию эксперимента при работе с твердотельными приборами.	*умеет* применять методы анализа экспериментальных данных, полученных при работе с твердотельными приборами; *умеет* применять методы обработки экспериментальных данных, полученных при работе с твердотельными приборами; *умеет* организовывать и проводить эксперимент при работе с твердотельными приборами.	*владеет* системным подходом к анализу экспериментальных результатов, полученных при работе с твердотельными приборами; *владеет* методами обработки результатов измерения параметров твердотельных приборов.
Хорошо (базовый уровень)	*знает* основные приемы обработки экспериментальных данных при исследование параметров твердотельных приборов; *знает* основные методы обработки экспериментальных данных при исследование параметров твердотельных приборов.	*умеет* применять основные методы обработки экспериментальных данных, полученных при работе с твердотельными приборами; *умеет* проводить эксперимент при работе с твердотельными приборами.	*владеет* методами обработки результатов измерения параметров твердотельных приборов.
Удовлетворительно (пороговый уровень)	*знает* базовые приемы обработки экспериментальных данных при исследование параметров твердотельных приборов.	*умеет* проводить эксперимент при работе с твердотельными приборами, под руководством преподавателя.	*обрабатывает* результаты измерений параметров твердотельных приборов.

2.4 Компетенция ОПК-7

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Содержание этапов формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	**Знать**	**Уметь**	**Владеть**
Содержание этапов	*знает* современные тенденции развития электроники; *знает* современные тенденции развития измерительной и вычислительной техники;	*умеет* использовать современное оборудование в своей профессиональной деятельности; *умеет* учитывать современ-	*иметь опыт* работы с современным оборудованием, используемым в своей профессиональной деятельности.

Согласована на портале № 14487

		ные тенденции развития электроники;	
Виды занятий	Лекции; Практические занятия; Групповые консультации	Практические занятия; Лабораторные работы; Индивидуальное задание; Самостоятельная работа	Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	Опрос на лекции; Контрольная работа; Индивидуальное задание (защита); Лабораторная работа (защита); Зачет	Индивидуальное задание (выполнение, оформление); Лабораторная работа (выполнение, оформление)	Лабораторная работа (защита); Зачет

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех этапах приведены в таблице 2.2 в п. 2.1.

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Показатели и критерии	**Знать**	**Уметь**	**Владеть**
Отлично (высокий уровень)	*знает* современные тенденции развития электроники; *знает* современное измерительное оборудование, используемое в электронике и наноэлектронике; *знает* современное вычислительное оборудование, используемой в электронике и наноэлектронике.	*умеет* использовать современное оборудование в своей профессиональной деятельности; *умеет* учитывать современные тенденции развития электроники.	*иметь опыт* работы с современным оборудованием, используемым в своей профессиональной деятельности.
Хорошо (базовый уровень)	*знает* современные тенденции развития электроники; *знает* современное измерительное оборудование, используемое в электронике и наноэлектронике.	*умеет* использовать современное оборудование в своей профессиональной деятельности.	*иметь опыт* работы с базовым оборудованием, используемым в своей профессиональной деятельности.
Удовлетворительно (пороговый уровень)	*знает* современные тенденции развития электроники.	*использует* современное оборудование в своей профессиональной деятельности, под руководством преподавателя.	*иметь опыт* работы с базовым оборудованием, используемым в своей профессиональной деятельности, под руководством преподавателя.

2.5 Компетенция ПК-1

ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Содержание этапов формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.10.

Согласована на портале № 14487

Таблица 2.10 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	*знать* эквивалентные схемы приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; *знать* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов;	*уметь* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; *уметь* экспериментально определять параметры твердотельных приборов;	*владеть* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем
Виды занятий	Лекции; Практические занятия; Групповые консультации	Практические занятия; Лабораторные работы; Индивидуальное задание; Самостоятельная работа	Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	Опрос на лекции; Контрольная работа; Индивидуальное задание (защита); Лабораторная работа (защита); Зачет	Индивидуальное задание (выполнение, оформление); Лабораторная работа (выполнение, оформление)	Лабораторная работа (защита); Зачет

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех этапах приведены в таблице 2.2 в п. 2.1.

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	*знает* эквивалентные схемы твердотельных приборов; *знает* методы определения и расчета параметров эквивалентных схем твердотельных приборов; *знает* стандартные программные средства для компьютерного моделирования приборов, схем, устройств электроники и наноэлектроники; *знает* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов; *знает* способы построения физических и математических моделей твердотельных приборов.	*умеет* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; *умеет* экспериментально определять параметры твердотельных приборов; *умеет* использовать стандартные программные средства для компьютерного моделирования приборов, схем и установок электроники и наноэлектроники.	*владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных схем; *владеет* методикой расчета параметров твердотельных приборов.
Хорошо (базовый уровень)	*знает* эквивалентные схемы твердотельных приборов; *знает* стандартные про-	*умеет* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов;	*владеет* навыками практической работы с полупроводниковыми приборами и элементами электронных

Согласована на портале № 14487

	граммные средства для компьютерного моделирования приборов, схем, устройств электроники и наноэлектроники; *знает* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов; *знает* способы построения простейших физических и математических моделей твердотельных приборов.	*умеет* использовать стандартные программные средства для компьютерного моделирования приборов, схем и установок электроники и наноэлектроники.	схем.
Удовлетворительно (пороговый уровень)	*знает* эквивалентные схемы твердотельных приборов; *знает* стандартные программные средства для компьютерного моделирования приборов, схем, устройств электроники и наноэлектроники; *знает* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов.	*умеет* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов.	*работает* с твердотельными приборами, под руководством преподавателя.

2.6 Компетенция ПК-2

ПК-2 способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Содержание этапов формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	*знает* эквивалентные схемы приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; *знает* устройство, принцип действия и основные технические характеристики основных классов полупроводниковых приборов	*умеет* производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; *умеет* экспериментально определять параметры твердотельных приборов	*владеть* методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов.
Виды занятий	Лекции; Практические занятия; Групповые консультации	Практические занятия; Лабораторные работы; Индивидуальное задание; Самостоятельная работа	Лабораторные работы;
Используемые средства оценивания	Опрос на лекции; Контрольная работа; Индивидуальное задание (защита); Лабораторная работа (защи-	Индивидуальное задание (выполнение, оформление); Лабораторная работа (выполнение, оформление)	Лабораторная работа (защита); Зачет

Согласована на портале № 14487

	та); Зачет		

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции на всех этапах приведены в таблице 2.2 в п. 2.1.

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Показатели и критерии	**Знать**	**Уметь**	**Владеть**
Отлично (высокий уровень)	*понимает* связь между параметрами и характеристиками эквивалентных схем; *аргументирует* выбор метода расчета основных параметров эквивалентных схем; *знает* эквивалентные схемы приборов электроники и наноэлектроники	*умеет* математически описывать связь между параметрами эквивалентных схем полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения; *умеет выбирать* метод расчета основных параметров эквивалентных схем полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения; *умеет* экспериментально определять параметры твердотельных приборов электроники и наноэлектроники	*владеет* методиками расчета параметров полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения; *владеет* методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
Хорошо (базовый уровень)	*распознает* эквивалентные схемы полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения; *знает* принцип действия основных классов полупроводниковых приборов и основные технические характеристики; *определяет* методы расчета параметров эквивалентных схем приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;	*самостоятельно подбирает* и готовит для эксперимента необходимое оборудование; *умеет рассчитывать* основные параметры полупроводниковых приборов и эквивалентных схем замещения;	*владеет* методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
Удовлетворительно (пороговый уровень)	*дает* определения основных понятий; *распознает* эквивалентные схемы полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники; *знает* принцип действия основных классов полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники	*умеет* работать со справочной литературой; *использует* приборы, указанные в описании лабораторной работы; *умеет производить* расчет параметров основных приборов электроники и наноэлектроники	*владеет* методами экспериментального исследования параметров полупроводниковых приборов электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Согласована на портале № 14487

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются следующие материалы:

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в составе: контрольные работы, индивидуальные задания, практические задания, лабораторные работы, самостоятельная работа, курсовой проект, экзамен.

3.1 Контрольные работы

1. Расчет параметров полупроводниковых диодов.
2. Расчет параметров биполярных транзисторов.

3.2 Индивидуальные задания

1. Расчет полупроводниковых диодов.
2. Расчет параметров биполярных транзисторов.

3.3 Лабораторные работы

1. Исследование вольт-амперной характеристики p-n перехода.
2. Исследование вольт-емкостных характеристик полупроводникового диода.
3. Изучение переходных процессов в полупроводниковом диоде.
4. Исследование статических характеристик биполярного транзистора.
5. Определение параметров биполярного транзистора.
6. Исследование характеристик полевого транзистора с управляющим p-n переходом.

3.4 Темы для самостоятельной работы

1. Физические основы твердотельной электроники.
2. Электронно-дырочный переход.
3. Полупроводниковые диоды.
4. Биполярные транзисторы.
5. Полевые транзисторы.
6. Тиристоры.

3.5 Зачет

1. Фундаментальная система уравнений твердотельной электроники.
2. Собственные, примесные и компенсированные полупроводники.
3. Генерация и рекомбинация носителей в полупроводниках.
4. Контакт металл-полупроводник.
5. Диод Шоттки.
6. Омические контакты.
7. Механизм образования электронно-дырочного перехода (ЭДП).
8. Контактная разность потенциалов, ее зависимость от концентрации легирующей примеси, температуры и ширины запрещенной зоны.
9. Энергетические диаграммы ЭДП при прямом и обратном смещениях.
10. Потоки носителей зарядов и принцип выпрямления тока ЭДП.
11. Методы получения ЭДП: сплавление, диффузия, ионное легирование, эпитаксия.
12. Понятие плавного и резкого, симметричного и несимметричного ЭДП, точечные и плоскостные ЭДП.
13. Классификация диодов.
14. Выпрямительные диоды.
15. Варикапы.
16. Стабилитрон.
17. Туннельный диод.
18. Фотодиод.
19. Светодиод.
20. Биполярный транзистор (БТ): определение, схемы включения, режимы работы.
21. Дрейфовый и бездрейфовый БТ.

Согласована на портале № 14487

22. Схема потоков носителей в БТ.
23. Внутренние параметры БТ: γ, αП, α*.
24. Внешние параметры БТ: α, β.
25. Статические характеристики БТ.
26. Усилительные свойства БТ.
27. Частотные параметры БТ.
28. Эквивалентная схема БТ.
29. БТ как четырехполюсник. Система y, z, h – параметров.
30. Мощные БТ.
31. Лавинный БТ.
32. Однопереходный транзистор.
33. Инжекционный транзистор.
34. Шумы в БТ.
35. Модель Эберса–Молла.
36. Классификация и маркировка БТ.
37. Полевые транзисторы (ПТ): определение, виды.
38. ПТ с управляющим переходом и барьером Шоттки.
39. ПТ с индуцированным и встроенным каналом.
40. Комплементарная пара. Параметры ПТ. Достоинства и недостатки.
41. Вертикальный МДП-транзистор.
42. ПТШ.
43. HEMT.
44. Тиристоры: определение, виды.
45. Принцип действия диодного тиристора.
46. Триодный тиристор.
47. Симметричный тиристор.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Основная литература

1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физические основы электроники. – Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2013. – 560 с. – [электронный ресурс]. – https://e.lanbook.com/book/5856

2. Шангин, А. С. Твердотельные приборы и устройства: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Шангин А. С. — Томск: ТУСУР, 2012. — 156 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2438

4.2 Дополнительная литература

1. Троян П.Е. Твердотельная электроника. – Учебное пособие. – Томск: ТУСУР, 2006. – 321 с. **(48)**

2. Гаман З.И. Физика полупроводниковых приборов: Учебное пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2000. – 426 с. **(45)**

3. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. – М.: Сов. радио, 1990. – 264 с. **(21)**

4. Крутякова М.Г., Чарыков Н.А., Юдин В.В. Полупроводниковые приборы и основы их проектирования. – М.: Радио и связь, 1983. – 352 с. **(6)**

5. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2006. – 480 с. **(98)**

6. Гуртов В.А. Твердотельная электроника: Учебное пособие. – М.: Техносфера, 2005. – 408 с. (**88**)

7. Твердотельная электроника: учебное пособие для вузов / Э. Н. Воронков [и др.]. – М.: Академия, 2009. – 317 с. **(4)**

4.3 Учебно-методические пособия и программное обеспечение

1. Троян П.Е. Твердотельная электроника. Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе. – Томск: ТУСУР, 2007. – 76 с. **(47)**

2. Жигальский А.А. Твердотельная электроника: Методические указания по выполнению лабораторных работ. – Томск: ТУСУР, 2007. – 59 с. (**29**)

Согласована на портале № 14487

4.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Образовательный портал в свободном доступе: «Физика, химия, математика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. Варгина» – Режим доступа: http://www.ph4s.ru/

2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа: http://window.edu.ru/

3. «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru

4. «Научно-образовательный портал ТУСУР» [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал университета. – Режим доступа: http://edu.tusur.ru/

Согласована на портале № 14487